

---

---

**Surface chemical analysis —  
Secondary ion mass spectrometry  
— Method for determining yield  
volume in argon cluster sputter depth  
profiling of organic materials**

*Analyse chimique des surfaces — Spectrométrie de masse des ions secondaires — Méthode de détermination du rendement volumique dans le cadre du profilage en profondeur de matériaux organiques par pulvérisation d'argon en grappe*



**Pour plus d'infos, merci de nous contacter.**

**Association Sénégalaise de Normalisation**

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage  
Dakar - SENEGAL

**Tel: +221 33 829 58 25**

**Email: [asn@asn.sn](mailto:asn@asn.sn)**